

USPTO、特許の品質向上に関するパブリックコメントを募集

2009年12月9日
JETRO NY 中楨、横田

米国特許商標庁(USPTO)は、本日付フェデラルレジスター(官報)¹において、特許の品質向上に関するパブリックコメントの募集を開始した。

同官報によれば、USPTOは全般的な特許の品質に係る取組を行っており、今回のパブリックコメントはその一環として、特に最適な先行技術文献の入手、最初の出願準備、出願の審査と手続きの各プロセスに焦点を当てたいとしており、この観点から、①発行される特許の品質向上、②品質を測る適切な指標の特定、③指標の測定に係る基準確立のため、出願人/USPTOによって利用される手法に関してパブリックコメントを募集したいとしている。官報の概要は以下のとおり。

<官報の概要> ※パブリックコメント募集項目等の詳細については官報を参照。

同官報によれば、質の向上は、以下の4つのプロセスによって得られるとしている。

1. 品質に影響する審査プロセスの鍵となる要素の特定
2. 望ましい品質項目の指標の特定
3. 上記指標の測定が有効にできるプロセスの確立(指標測定の評価基準の確立)
4. 高品質の特許と審査待ち期間の短縮に望ましい向上をもたらすため、品質項目を最も成功した成果を出せるものにするための政策やUSPTOの運用の確立と修正

なお、同官報内では、「高品質の特許(quality patent)」に関する定義を置いており²、そこでは当該特許が持つ経済価値は関係ないとしている。

また、同官報では、パブリックコメントを容易にするためとして、7つの分類(カテゴリ)を行い、それぞれUSPTOとしてコメントを求めたい事項を具体的に示している。

<7つのカテゴリ>

- (1) 使用すべき品質評価手法(Quality measures used)

現在使用中の評価手法のフィードバック、及び新たな評価手法について

- (2) モニターすべき段階(Stages of Monitoring)

品質管理をすべき段階(出願受理時、最初のサーチ終了時、FA終了時等)について

¹ 官報 <http://edocket.access.gpo.gov/2009/pdf/E9-29328.pdf>

² 官報 p.65094 中段を参照。

- (3) 審査待ち期間(Pendency)
審査待ち期間短縮と品質向上の両立が実施可能かについて
- (4) 試行プログラム(pilot Programs)
従来の品質向上に係る試行プログラム(peer to Patent や FA 前面接審査等)に係るフィードバック
- (5) 質に関する顧客世論調査(Customer Surveys regarding Quality)
USPTO が過去実施した調査(Customer Panel Quality Survey:CPQS)に関するフィードバック
- (6) 目標達成のためのツール(Tools for Achieving Objectives)
品質向上に関し出願人/USPTO が利用可能な既存のツール(監視を充実させるソフトウェア等)の特定
- (7) インセンティブ(Incentives)
出願人/USPTO 職員が品質向上の達成を支える手続きや実務を行うようにするインセンティブについて

今回の官報では、パブリックコメントを募集する事項の具体的内容に加え、募集情報に係る背景(官報「Ⅳ. 」)や USPTO が特に関心を持っている分野(官報「Ⅴ. 」)についても細かく記載されているところ、詳細については官報を参照されたい。

なお、提出されたコメントや提案は、同じく官報に掲載された基準によって評価されるとしている(官報「Ⅲ. 」を参照)。コメントの提出期限は 2010 年 2 月 8 日であり、本パブリックコメントに関する公聴会は開催しないとしている。

(了)